物相定量分析

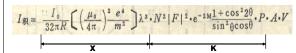
原理: 衍射线的强度或相对强度与物相在样品中的含量相关

- 历史: 1) 1936 年, 矿粉中石英含量的X射线定量分析

 - 2) 1948年,Alexander提出了著名的内标法理论; 3) 1974年,Chung等提出了著名的基体冲洗法(K值法), 其后又提出了绝热法;
 - 4) Hubbard、刘沃恒等还提出了其它分析方法。
 - 5) Rietveld全谱拟合无标样定量分析。

物相定量分析

基础理论公式(粉末平板状样品):



对于同一张衍射谱的各线, \mathbf{X} 是相同的;对于混合物中的第 \mathbf{j} 相的某个晶面的相对积分强度 \mathbf{j} 则有。

$$\mathbf{I}_{j} = \frac{\mathsf{K}_{j} \bullet \mathsf{X}_{j}}{\rho_{j} \bullet \mu_{\mathsf{m}}}$$

 X_{j} : j相在混合相中的重量百分数; ho_{j} : j相的密度; μ_{m} : 混合物的质量吸收系数; K_{j} : 强度因子

注:在衍射仪中A=1/2us V是衍射体积

方法:

- 1、直接对比法
- 2、外标法
- 3、内标法
- 4、无标样法

物相定量分析的直接对比法

此法是以两相的衍射强度比为基础,强度参此量通 过理论计算。适用于淬火钢中残余奥氏体的测定和其 它种同类异型转变。

1. 基本计算公式

如待测试样中含有 \mathbf{n} 个相,它的体积分数为 V_i ,各相 含量的总和等于1

 $\sum_{i=1}^{n} V_i = 1$ 可写出n个强度方程

$$I_{i} = CK_{i} \frac{V_{i}}{2 \rho \sum_{i=1}^{n} W_{i}(\mu m)_{i}} \quad i = 1, 2, \dots, m, \dots, n$$

用其中的某一个方程去除其余方程可得n-

$$\frac{I_i}{I_m} = \frac{K_i}{K_m} \cdot \frac{V_i}{V_m} \quad \text{iff} \quad V_i = \frac{I_i}{I_m} \cdot \frac{K_m}{K_i} \cdot V_m \tag{7}$$

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{I_i}{I_m} \cdot \frac{K_m}{K_i} \cdot V_m = \frac{K_m}{I_m} \cdot V_m \sum_{i=1}^{n} \frac{I_i}{K_i} = 1$$

或
$$V_m = \frac{I_m}{K_m} / \sum_{i=1}^n \frac{I_i}{K_i}$$
 (8)

$$\text{Pr} X (7) \quad V_i = \frac{I_i}{K_i} / \sum_{i=1}^n \frac{I_i}{K_i} = \frac{I_i}{K_i \sum_{i=1}^n \frac{I_i}{K_i}}$$

将实验得到的I和计算得到的K代入(8) 求得 V_i , 利用 $W_i = V_i \rho_i / \rho$ 求得 W_i

此法在检测钢中残余奥氏体中有成功的应用。虽然残 奥可用金相法和磁性法测得,但是,当残奥量少时, 这两种方法误差大。用X射线衍射直接对比法可以测 出约1%的残奥。

物相定量分析的外标法

采用对比试样中第j相的某衍射线和纯j相(外标物质)的同一条衍射线强度而获得样品中第j相的含量;

$$\mathbf{I_j} = \frac{\mathbf{K_j} \bullet \mathbf{X_j}}{\rho_i \bullet \mu_m}$$

 $\mu_{m}\text{=}\textbf{X}_{1}\mu_{m1}\text{+}\textbf{X}_{2}\mu_{m2}\text{=}\textbf{X}_{1}\ (\mu_{m1}\text{-}\mu_{m2})\ \text{+}\mu_{m2}$

$$I_1/I_{10} = \frac{X_1 \mu_{m1}}{X_1(\mu_{m1} - \mu_{m2}) + \mu_{m2}}$$

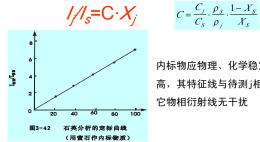
两相系统中只要已知各相的质量吸收系数,在实验测试条件严格一致 的情况下,分别测试得某相的一衍射线强度及对应的该纯相相同衍射线强 度,即可获得待测试样中该相的含量。

特殊情况: 当物相1与物相2的吸收系数相同时:

$$I_1/I_{10} = X_1$$

物相定量分析内标法

在试样中加入某种标准物相来进行分析; 物相数大于2,且各相的吸收系数不同时常用此法



$$C = \frac{C_j}{C_s} \cdot \frac{\rho_s}{\rho_s} \cdot \frac{1 - X_s}{X_s}$$

内标物应物理、化学稳定性 高,其特征线与待测j相及其 它物相衍射线无干扰

物相定量分析基体冲洗法(K值法)

不需绘制定标曲线(简化实验和分析)

$$I_j / I_s = K_s^j \cdot \frac{1 - X_s}{X_s} \cdot X_j$$

用纯参考相s与待测相 j 以1:1的质量比混合,测定两相的 最强线强度而得 K_s^f

物相定量分析分析程序

(1) 物相鉴定

对样品进行待测物相的相鉴定(X射线物相定性分析), 确定峰位

(2) 选择标样物相

选择标样物相(理化性能稳定,与待测物相衍射线无干扰,在混合及制样 时,不易引起晶体的择优取向)

(3) 测定定标曲线

选择的标样物相与纯的待测物相按要求制成混合试样,测定其强度 / 如/, 用 $/\!\!//_s$ 和纯相配比 X_s^j 获取定标曲线或 X_s^j

- (4)测定试样中标准物相j的强度或测定按要求制备试样中的特检物相j及标样S 物相指定衍射线的强度。
- (5) 用所测定的数据,按各自的方法计算出待检物相的质量分数 义。

应注意的问题

在定量分析的基本公式中,假设了被测物相中晶粒尺寸非 常细小,各相混合均匀,无择优取向。

实际情况有所不同。在试样制备及标样选择时,避免重 压,减少择优取向,通常采用透过窗样品架,而在测量时,采 用样品从其面法线转动来消除择优取向的影响。